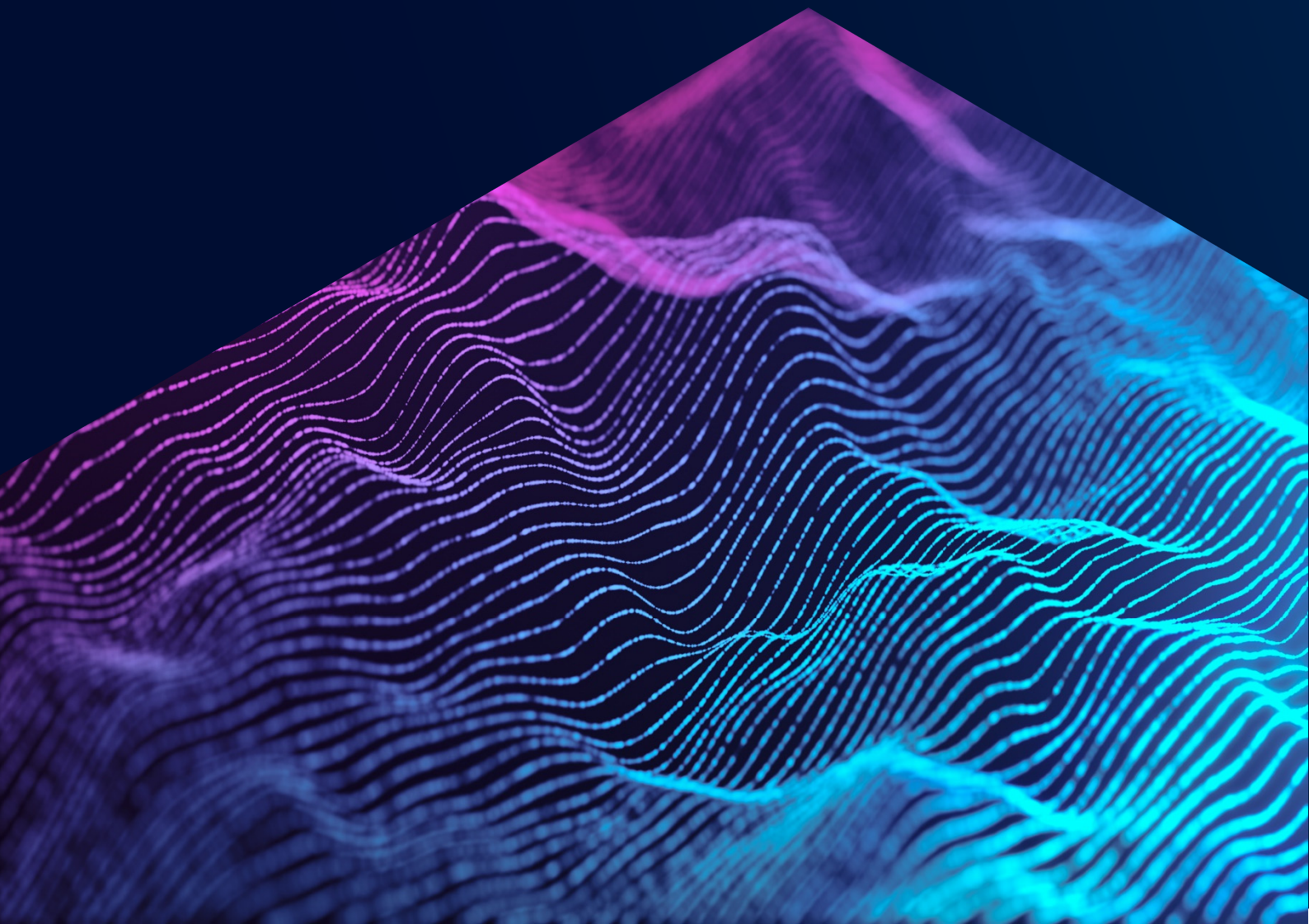
CAS STNext®

特許全文ファイル

202507

JAICI 化学情報協会

CAS A division of the American Chemical Society

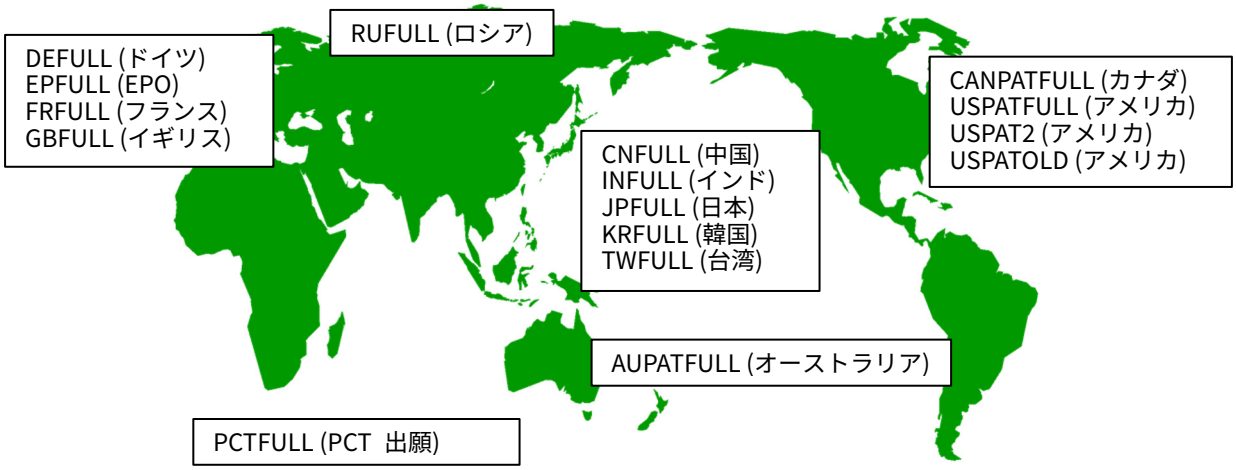


目次

CAS STNext の特許全文ファイル.....1
表示形式 10
テキスト検索 11
テキスト中の数値検索 13
特許番号類の検索 18
特許出願人の検索 21
最終権利者の検索 21
特許分類の検索 23
参考 : Interactive Claims Viewer 29
参考 : Register リンク 30

CAS STNext® の特許全文ファイル

CAS STNext では、14 特許発行国・機関の特許全文ファイルを利用できる。



CAS STNext で特許全文ファイルを検索するメリット

- 検索フィールドや近接演算子が多数あるので、きめ細やかな検索が可能。
- オリジナル言語にかかわらず、英語で検索・表示できる。
- テキスト中の数値検索機能が利用できる。
- CAS REGISTRY、CAplus など CAS STNext の他のファイルとの連携が可能。
- 多くの特許全文ファイルに、STN が独自に付与している Key Terms が収録されており、より網羅的なキーワード検索ができる。
- USPATFULL/USPAT2/USPATOLD ファイルでは、CA の索引情報を利用した検索ができる。
- USPATFULL/USPAT2 ファイルでは、特許明細書中の重要な化学物質の記載位置確認に便利な CAS PatentPak® を利用できる。
- 一部のファイルでは、特許請求項をツリー形式で表示する Interactive Claims Viewer を利用できる。
- Register リンクを使って、各国特許庁や関連サイトにすぐにアクセスすることができる。

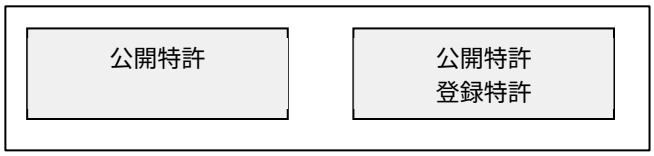
特許全文ファイル概要

ファイル名	収録国	収録年代	レコード構成	更新頻度	テキスト中の数値検索ﾀｲﾌﾟ *1	備考
AUPATFULL	オーストラリア	1917-	出願	毎週	C	
CANPATFULL	カナダ	1869-	出願	毎週	C	
CNFULL	中国	1985-	出願	毎週	C	
DEFULL	ドイツ	1877-	出願	毎週	C	
EPFULL	欧州	1978-	出願	毎週	C	Interactive Claims Viewer を搭載*2
FRFULL	フランス	1902-	出願	毎週	C	
GBFULL	イギリス	1855-	出願	毎週	C	
INFULL	インド	1912-	出願	毎週	C	
JPFULL	日本	1919-	出願	毎週	C	Interactive Claims Viewer を搭載*2
KRFULL	韓国	1978-	出願	毎週	C	
PCTFULL	PCT 出願	1978-	出願	毎週	C	Interactive Claims Viewer を搭載*2
TWFULL	台湾	1950-	出願	毎週	C	
RUFULL	ロシア	1924-	出願	毎週	C	
USPATFULL	米国	1971-	公報	週 2 回	C	USPATOLD 以外に CAS PatentPak を搭載
USPAT2		2001-	公報	週 2 回	C	
USPATOLD		1790-1975	公報	なし	—	化学分野の特許に CA の索引情報を収録

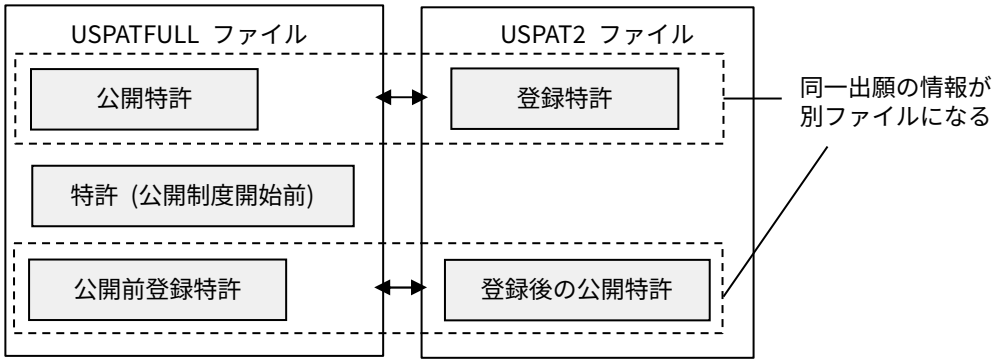
*1 P.13-16 参照、*2 P.22 参照

レコード構成

- 出願単位： 同一出願単位のレコード構成。公開公報と登録公報の全文を同一レコードに収録



- 公報単位： 公報ごとのレコード構成。公開公報と登録公報の全文は、異なるファイルに収録。最初に発行された公報は USPATFULL ファイル、最新の公報は USPAT2 ファイルに収録される。古い年代は USPATOLD ファイルに収録される。



出願単位ファイルのレコード例 (JPFULL ファイル、MAX 表示形式)

レコード番号	AN	2022182180 JPFULL EDP 20240311 ED 20240311 UP 20240915 EDTX 20240311 DED 20240305 DUPD 20240911 Full-text
標題	TIEN	Training a Distributively Robust Model
標題 (日本語)	TIJA	分布的にロバストなモデルの訓練
発明者 (日本語)	INJA	バルソピア ヴィヴェク, 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内 亀田 義男, :
特許出願人	PA	NEC CORP;
特許出願人 (日本語)	PAJA	日本電気株式会社, 東京都港区芝五丁目7番1号
特許出願人、標準形式	PAS	NEC
特許出願人、統制形式	PAN	NEC
特許出願人番号	PA.NO	000004237
最終権利者	UO	NEC CORPORATION
最終権利者、標準形式	UOS	NEC
代理人 (日本語)	AGJA	松沼 泰史 橋本 隆史
出願言語	LAF	Japanese
言語	LA	Japanese
資料種類	DT	Patent; (Fulltext)
特許情報	PI	JP 2024509849 A 20240305
特許情報、公報ﾀｲﾌﾟ	PIT	JPA PUBLISHED UNEXAMINED PATENT APPLICATION [FROM 19710716 ONWARDS] or PUBLISHED UNEXAMINED PATENT APPLICATION (BASED ON INTERNATIONAL APPLICATION) [FROM 19790726 ONWARDS]
出願情報	AI	JP 2023-553532 20220304
優先権出願情報	PRAI	US 2021-63160659 20210312 US 2021-17392261 20210803 JP 2022-9458 20220304
関連特許情報	RLPI	WO 2022191073 20220915
関連出願情報	RLI	WO 2022-JP9458 20220304 PCT Application
国際特許分類 (発行時)	IPCI	G06N0020-00 [I,A]; G06F0018-24 [I,A];
共通特許分類	CPC	G06N0020-00; G06N0003-045; G06N0003
FI	FCL	G06N0020-00; G06N0003-094; G06F0018
抄録	ABEN	Equivalent from US2022292345A1 Distributionally robust models are obtained by operations including training, according to a loss function, a first learning function with a training data set to produce a first model, the training data set including a plurality of samples. The operations may further include training a second learning function with the training data set to :
詳細な説明	DETDEN	[DESC0001] The present disclosure relates to training a distributively robust model. [DESC0002] In supervised machine learning, training dataset curated by someone familiar with the process. Although a lot of effort can be spent to ensure that the training dataset is a balanced representation of the distribution of the data represented, a potential subpopulation is usually present in the training dataset. Such :

標題 (TI) は機械翻訳の後、JAPIO 由来の人手翻訳に置き換わる

公開特許

登録特許

機械翻訳の英語抄録または対応特許由来の英語抄録 (INPADOC 由来) を収録
機械翻訳の抄録はその後 JAPIO 由来の人手翻訳に置き換わる

日本特許を機械翻訳した英語の詳細な説明を収録

クレーム　CLMEN

[CLM0001] Generating a first model by tra
using a training dataset containing a plu
the loss function;
 Training a second learning function using the training data set to generate a second model having a higher accuracy than the first model;
:

日本特許を機械翻訳した英語のクレームを収録

[CLM0002] The computer-readable medium of claim 1, wherein the first model has a higher interpretability than the second model.

[CLM0003] The first learning functi
dimension lower than the second lea
:

出願単位のファイルでは、1 レコードで、公報ごとの情報を確認できる

レコード番号	AN	2022182180　JPFULL EDP 20240311　ED 20240811 UP 20240915 EDTX 20240811 DED 20240806 DUPD 20240911 Full-text
標題	TIEN	Training a Distributively Robust Model
標題（日本語）	TIJA	分布的にロバストなモデルの訓練
発明者（日本語）	INJA	バルソピア ヴィヴェク， 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内 亀田 義男， :
特許出願人	PA	NEC CORP;
特許出願人（日本語）	PAJA	日本電気株式会社， 東京都港区芝五丁目7番1号
特許出願人、標準形式	PAS	NEC
特許出願人、統制形式	PAN	NEC
特許出願人番号	PA.NO	000004237
最終権利者	UO	NEC CORPORATION
最終権利者、標準形式	UOS	NEC
代理人（日本語）	AGJA	松沼　泰史 橋本　隆史
出願言語	LAF	Japanese
言語	LA	Japanese
資料種類	DT	Patent; (Fulltext)
特許情報	PI	JP 7529165B　B2　20240806
特許情報、公報ﾀｲﾌﾟ	PIT	JPB2 PUBLISHED EXAMINED PATENT APPLICATION (SECOND LEVEL) [FROM 19710716 ONWARDS] or PUBLISHED GRANTED PATENT (SECOND LEVEL) [FROM 19960301 ONWARDS]
出願情報	AI	JP 2023-553532　20220304
優先権出願情報	PRAI	US 2021-63160659　20210312 US 2021-17392261　20210803 JP 2022-9458　20220304
関連特許情報	RLPI	WO 2022191073　20220915
関連出願情報	RLI	WO 2022-JP9458　20220304　PCT Application
国際特許分類（発行時）	IPCI	G06N0020-00 [I,A]; G06F0018-24 [I,A]; G06F0018-27 [I,A]; G06N0003-094 [I,A]
共通特許分類	CPC	G06N0020-00; G06N0003-045; G06N0003-08
FI	FCL	G06N0020-00; G06N0003-094; G06F0018-24; G06F0018-27

公開特許

登録特許

抄録　ABEN

Equivalent from US2022292345A1
Distributionally robust models are obtained by operations including training, according to a loss function, a first learning function with a training data set to produce a first model, the training data set including a plurality of samples. The operations may further include training a second learning function with the training data set to
:

詳細な説明 DETDEN

[DESC0001] The present disclosure relates to training a distributively robust model.

[DESC0002] In supervised machine learning, training is based on a training dataset curated by someone familiar with the process. Although a lot of effort can be spent to ensure that the training dataset is a balanced representation of the distribution of the data represented, a potential subpopulation is usually present in the training dataset. Such potential subpopulations can be over- or underrepresented by the training data set, resulting in an unexpected imbalance to the training

:

クレーム CLMEN

[CLM0001] Generating a first model by training a first learning function using a training dataset containing a plurality of Mr./Ms. pulls according to the loss function;

Training a second learning function using the training data set to generate a second model having a higher accuracy than the first model;

Based on the difference in loss between the first model and the second model, assigning an adversarial weight to each Mr. / Ms. of the plurality of Mr. / Ms. supples;

According to the loss function, the first learning function is retrained using the training data set to generate a distributionally robust model, wherein during retraining, the loss function is based Mr./Ms.Mr./Ms.on the assigned adversarial weight.

A program that causes a computer to perform an action that includes:

[CLM0002] The program of claim 1, wherein the first model has a higher degree of interpretability than the second model.

[CLM0003] The first learning function has a Vapnik-Chervonenkis (VC) dimension lower than the second learning function, a lower number of parameters than the second learning function, or a lower minimum description length than the second learning function.

[CLM0004] The retraining incl
and each retraining iteration
includes reassignment of host
The reassignment is based o
model trained on the previous
retraining iterations and the
The program according to cl

:

USPATFULL/USPAT2/USPATOLD ファイル以外の特許全文ファイルには Key Terms が収録されている。
Key Terms は、言語学的および統計学的手法を用いて、英語の特許全文中から機械的に抽出した 1-5 単語からなる名詞句で、STN が独自に付与している

Key Terms KT

learning function; training data; interpretable model; complex model; adversarial weight; robust model; regression model; classification model; machine learning algorithm; interpretable classifier function; classification function; assignment section assign weight; complex classifier; regression function; model parameter; network interface; network adapter card; accurate model; hybrid model; retraining iteration; transfer computer-readable program instruction; loss function; computer-readable medium; training dataset; adversarial weighting scheme; training section; improve classifier lifetime; logic function; computing device; interpretable hypothesis class

公報単位のレコード例 (USPATFULL ファイル、MAX 表示形式)

```
                PatentPak PDF | PatentPak PDF+ | PatentPak Interactive
ﾚｺｰﾄﾞ番号  AN      2018:188066  USPATFULL Full-text
標題       TI      LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DI
発明者名   IN      Saito, Masayuki, Chiba, JAPAN
特許出願名 (会社)  PA      JNC CORPORATION, Tokyo, JAPAN (non-U.S. corporation)
                   JNC PETROCHEMICAL CORPORATION, Tokyo, JAPAN (non-U.S. corporation)
特許番号   PI      US 20180163133      A1  20180614
                   US 10640709         B2  20200505
出願番号   AI      US 2017-15832722    A1  20171205 (15)
優先権情報 PRAI    JP 2016-238308          20161208
資料種類   DT      Utility
ファイルセグメント FS  APPLICATION

譲渡情報   ASSIGNMENT HISTORY FOR US 20180163133

譲渡日     RAI   RAD:    20171212
USPTO のﾃﾞｰﾀ更新日 RAUP:  20180614
譲渡の種類        RAK:    ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
原特許出願人      PAO:    SAITO, MASAYUKI (DATE EXECUTED: 20171122)
譲渡先機関        RAC:    JNC CORPORATION, 2-1, OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU,, TOKYO, JAPAN
                          JNC PETROCHEMICAL CORPORATION, 2-1, OTEMACHI 2-CHOME,
                          CHIYODA-KU,, TOKYO, JAPAN
法定代理人        RAA:    JCIPRNET, P.O. BOX 600 TAIPEI GUTING, TAIPEI CITY, 10099 TAIWAN
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑﾘｰﾙ番号/  MRN:    44359     MFN: 68  (4 Page(s))
ｺﾏ番号             :
クレームの数  CLMN    Number of Claims: 14
代表クレーム番号 ECL  Exemplary Claim: 1
図面の数   DRWN    No Drawings
抄録       AB      Provided are a liquid crystal composition satisfying at least one of
                   characteristics such as high maximum temperature, low minimum
                   temperature, small viscosity, suitable optical anisotropy, large
                   dielectric anisotropy and a short helical pitch, or the liquid crystal
                     :
発明の要約 SUMM    CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

                   This application claims the priority benefit of Japanese application
                   serial no. 2016-238308, filed on Dec. 8, 2016. The entirety of the
                   above-mentioned patent application is hereby incorporated by reference
                   herein and made a part of this specification.

                   TECHNICAL FIELD

                   The invention relates to a liquid crystal composition having features of
                   containing an optically active compound having an octahydro
                   binaphthalene skeleton or a binaphthalene skeleton, a liquid crystal
                   display device including the composition, and so forth. In particular,
                   the invention relates to a liquid crystal composition having positive
                   dielectric anisotropy, and an active matrix (AM) device that includes
                   the composition and has a mode such as a TN mode, an OCB mode, an IPS
                   mode, an FFS mode or an FPA mode.
                     :
                TABLE 1

                Characteristics of composition and characteristics of AM device
                No.    Characteristics of composition  Characteristics of AM device

                1      Wide temperature range of a     Wide usable temperature range
                       nematic phase                   of the device
                2      Small viscosity                 Short response time
                3      Suitable optical anisotropy     Large contrast ratio
                         :
```

CAS PatentPak を搭載

公開特許

詳細な説明 DETD DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

The invention provides a liquid crystal composition satisfying at least one of characteristics such as high maximum temperature of a nematic phase, low minimum temperature of the nematic phase, small viscosity,

:

EXAMPLES

The invention will be described in greater detail by way of Examples. However, the invention is not limited by the Examples. The invention includes a mixture of a composition in Example 1 and a composition in Example 2. The invention also includes a mixture in which at least two compositions in Examples are mixed. The thus prepared compound was identified by methods such as an NMR ana
compound and the composition were measur

:

##STR21##

USPATFULL ファイルは、明細書で構造図が存在することを示す記号がある

Measuring method: Characteristics were measured according to the methods described below. Most of the measuring methods are applied as described in the Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association (hereinafter abbreviated as JEITA) (JEITA ED-2521B) discussed and established by JEITA, or modified thereon. No thin film transistor (TFT) was attached to a TN device used for measurement.

(1) Maximum temperature of nematic phase (NI; ° C.): A sample was placed on a hot plate in a melting point apparatus equipped with a polarizing microscope, and heated at a rate of 1° C. per minute. Temperature when part of the sample began to change from a nematic phase

:

TABLE 3

Method for description of compounds using
R−(A.sub.1)−Z.sub.1 . . .
−Z.sub.n−(A.sub.n)−R′

USPATFULL ファイルは、明細書の表中のテキストを抽出しているので、テキスト検索可能

1) Left-terminal group R−	Symbol
C.sub.nH.sub.2n+1−	n-
C.sub.nH.sub.2n+1O−	nO−

:

Example 1

1-BB-3	(3-3)	10%
V-HHB-1	(3-5)	8%
1-BB(F)B-2V	(3-8)	3%
2-BB(F)B-2V	(3-8)	4%
3-BB(F)B-2V	(3-8)	4%
5-HBB(F)B-2	(3-13)	6%
5-HBB(F)B-3	(3-13)	6%
3-BB(F)B(F, F)-F	(4-15)	6%
3-BB(F, F)XB(F, F)-F	(4-18)	20%
3-BB(F)B(F, F)XB(F, F)-F	(4-29)	4%
4-BB(F)B(F, F)XB(F, F)-F	(4-29)	4%
3-BB(F, F)XB(F)B(F, F)-F	(4-30)	13%
5-HB-CL	(4)	12%

NI=79.7° C.; Tc<−20° C.; Δn=0.179;
Δε=13.2; η=39.2 mPa·s.

:

クレーム　CLM　What is claimed is:
1. A liquid crystal composition that has a nematic phase, and contains at least one compound selected from the group of optically active compounds each having an octahydro binaphthalene skeleton or a binaphthalene skeleton represented by formula (1) and formula (2) as an additive, and at least one compound selected from the group of compounds represented by formula (3) as a first component: ##STR53## wherein, in formula (1) and formula (2), R.sup.1, R.sup.2 and R.sup.3 are independently hydrogen, halogen, cyano, −SF.sub.5 or alkyl having 1 to 10 carbons, and in the alkyl, at least one piece of −CH.sub.2− may be replaced by −O−, −COO−, −OCO−, −CH═CH− or −C≡C−, and in the groups, at least one hydrogen may be replaced by fluorine or chlorine; ring A, ring B, ring E and ring F are independently 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1,2-diyl or naphthalene-1,2-diyl; ring C, ring D and ring G are independently 1,4-cyclohexylene, 1,4-phenylene, 1,3-dioxane-2,5-diyl, tetrahydropyran-2,5-diyl, tetrahydropyran-3,5-diyl, pyrimidine-2,5-diyl, pyridine-2,5-diyl or 1,4-bicyclo-(2,2,2)-octylene, and in the rings, at least one hydrogen may be replaced by fluorine or chlorine; Z.sup.1, Z.sup.2, Z.sup.3, Z.sup.4 and Z.sup.5 are independently a single bond or alkylene having 1 to 20 carbons, and in the alkylene, at least one piece of −CH.sub.2− may be replaced by −O−, −CO−, −COO−, −OCO−, −CH═CH− or −C≡C−, and in the groups, at least one hydrogen may be replaced by fluorine or chlorine; and a, b and c are independently 2, 3 or 4, and in formula (3), R.sup.4 and R.sup.5 are independently alkyl having 1 to 12 carbons, alkoxy having 1 to 12 carbons, alkenyl having 2 to 12 carbons, or alkenyl having 2 to 12 carbons in which at least one hydrogen is replaced by fluorine or chlorine; ring I and ring J are independently 1,4-cyclohexylene, 1,4-phenylene, 2-fluoro-1,4-phenylene or 2,5-difluoro-1,4-phenylene; Z.sup.6 is a single bond, ethylene or carbonyloxy; and d is 1, 2 or 3.

2. The liquid crystal composition according to claim 1, containing at least one compound selected from the group of optically active compounds represented by formula (1-1) to formula (1-6) and formula (2-1) to
:

共通特許分類　CPC　CPCI　C09K0019-0208 [I]; C09K0019-0216 [I]; C09K0019-586 [I];
:
国際特許分類　IPC　IPCI　C09K0019-34 [I]; C09K0019-30 [I]; C09K0019-58 [I]; C09K0019-02
:

CHEMICAL ABSTRACTS INDEXING　COPYRIGHT 2022 ACS on STN

		PATENT	KIND	DATE
その他の収録源	OS	CA 169:99272 * US 20180163133	A1	20180614

* CA Indexing for this record included

分類ｺｰﾄﾞ/関連ｾｸｼｮﾝ　CC　74-13 (Radiation Chemistry, Photo graphic and Other Reprographic Processes)
補足語　ST　liq crystal compn display LCD
索引語　IT　Liquid crystal displays
Liquid crystals
(liq. crystal compn. for LCD)
索引語　IT　80955-71-1, 5-HBBH-3　83242-83-5, 3-HHEH-3　84540-32-9, 5-HB-O2
84655-98-1, 3-HHB-O1　84656-75-7, 3-HHB-1　84656-77-9, 3-HHB-3
86778-48-5, 5-HB-CL　88038-92-0, 3-HHEBH-3　89129-90-8, 4-HHEH-3
89139-36-6, 1O1-HBBH-3　92263-41-7, 3-HH-5　95759-44-7, 2-BB(F)B-3
:
(liq. crystal compn. for LCD)

CAS の物質索引
(CAS ロールは収録されていない)

CA 由来の索引情報

索引物質の記載　PPAK
ﾍﾟｰｼﾞ表示

80955-71-1, 5-HBBH-3, Pg 21
83242-83-5, 3-HHEH-3, Pg 22
84540-32-9, 5-HB-O2, Pg 20
84655-98-1, 3-HHB-O1, Pg 21
84656-75-7, 3-HHB-1, Pg 22
84656-77-9, 3-HHB-3, Pg 22
86778-48-5, 5-HB-CL, Pg 19
88038-92-0, 3-HHEBH-3, Pg 20
89129-90-8, 4-HHEH-3, Pg 20
89139-36-6, 1O1-HBBH-3, Pg 20
92263-41-7, 3-HH-5, Pg 20
95759-44-7, 2-BB(F)B-3, Pg 21
96624-41-8, 2-HH-3, Pg 20
96624-43-0, 2-HH-5, Pg 20
105351-42-6, 1V2-HH-3, Pg 21
106349-49-9, 5-HB(F)BH-3, Pg 21
115978-59-1, 3-HHEBH-4, Pg 23
116020-44-1, 3-HH-V, Pg 19
117713-14-1, V2-BB-1, Pg 21
117713-15-2, 1-BB-3, Pg 19
:

CAS PatentPak を搭載

表示形式

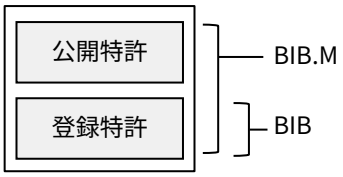
各ファイルの表示形式の詳細は、サマリーシートを参照する。
https://www.cas.org/training/documentation/stn/database-summary-sheets

出願単位のファイルの表示形式

- デフォルトの表示形式は STD.M (全公報の書誌情報と特許分類を表示)
- 主な表示形式

表示形式	内容
BIB	書誌情報
BRIEF	書誌情報、抄録、第一クレーム、Key Terms
STD	書誌情報、特許分類
ALL	書誌情報、特許分類、抄録、クレーム、詳細な説明
MAX (ALL.M)	書誌情報、特許分類、抄録、クレーム、詳細な説明 (全公報の情報を表示) Key Terms
TRIAL	回答チェック用の表示形式 (TI，IPC など)
KWIC	ヒットタームの前後 20 語

- BIB、STD、ALL 表示形式の後ろに .M をつけると、レコード中の全公報の情報を表示することができる。
- .M をつけない場合は最新公報の情報が表示される。

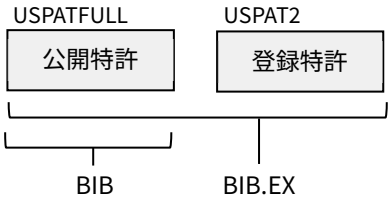


公報単位のファイル (USPATFULL/USPAT2/USPATOLD) の表示形式

- デフォルトの表示形式は STD (公報の書誌情報と特許分類を表示)
- 主な表示形式

表示形式	内容
BIB	書誌情報
STD	書誌情報、特許分類
ALL	書誌情報、特許分類、抄録、クレーム、詳細な説明
MAX	書誌情報、特許分類、抄録、クレーム、詳細な説明、譲渡情報、CA 索引情報
CAS	CA 索引情報
TRIAL	回答チェック用の表示形式 (TI，IPC など)
KWIC	ヒットタームの前後 20 語

- BIB、STD、ALL、MAX 表示形式は CAS PatentPak のリンクが表示される。
- BIB、STD、MAX 表示形式の後ろに .EX を付けると、該当する USPAT2/USPATFULL ファイルから情報を表示できる。



テキスト検索

検索語を基本索引で検索すれば、全文（標題、抄録、詳細な説明、クレーム）を対象にした検索を行うことができる。

- ファイルによっては Key Terms が収録されている。
  - Key Terms は、言語学的および統計学的手法を用いて英語の特許全文中から機械的に抽出した 1-5 単語からなる名詞句で、STN が独自に付与している。
- 基本索引フィールドに含まれる内容

ファイル名	標題	抄録	詳細な説明	ｸﾚｰﾑ	Key Terms	その他のフィールド
AUPATFULL, CANPATFULL, CNFULL, DEFULL, EPFULL, FRFULL, GBFULL, INFULL, JPFULL, KRFULL, PCTFULL, RUFULL, TWFULL	○	○	○	○	○	-
USPATFULL, USPAT2	○	○	○	○	収録なし	要約（SUMM), 図面の説明（DRWD), 親特許との関係（PARN), 政府所有権（GOVI)
USPATOLD	○	○	○	○	収録なし	CA の標題（TI.CA)

- 標題やクレーム中に出現するキーワードに限定したい場合は、専用の検索フィールド （/TI、/CLM など） を利用する。

フィールド	専用の検索フィールド	
	右記以外のファイル	USPATFULL/USPAT2/USPATOLD
標題（TI)	/TI	/TI
抄録（AB)	/AB	/AB
詳細な説明（DETD)	/DETD *1	-
クレーム（CLM)	/CLM (全クレーム) /MCLM (メインクレーム)	/CLM (全クレーム) /ECLM (メインクレーム)
Key Terms (KT)	/KT	- *2
政府所有権（GOVI)	- *2	/GOVI

＊1 /DETD は、RUFULL ファイルでは利用できない
＊2 収録されていない情報

収録言語

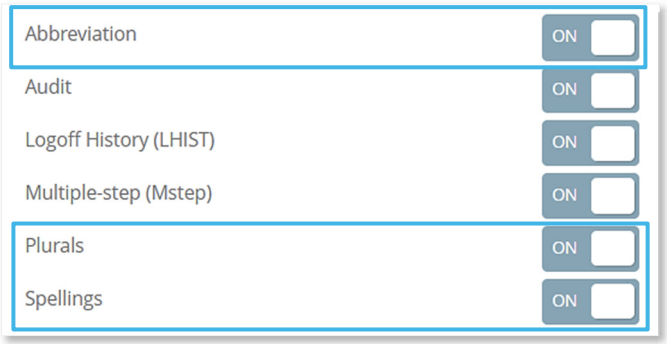
- オリジナル言語にかかわらず、英語で検索できる。
  - 下記表中の * つきのファイルは、一部のフィールドを下記の表以外のオリジナル言語で表示できる（検索はできない)。詳細はサマリーシート参照 https://www.cas.org/training/documentation/stn/database-summary-sheets

ファイル名	標題、抄録、クレーム、詳細な説明
AUPATFULL CNFULL* GBFULL JPFULL* KRFULL* TWFULL* USPATFULL USPAT2 USPATOLD	英語
CANPATFULL	英語・仏語
DEFULL	英語・独語
EPFULL	英語・仏語・独語
FRFULL	英語・仏語
PCTFULL*	英語・仏語・独語・西語

テキスト検索に有効な設定

テキスト検索に有効な設定は、CAS STNext のセッション画面右上の ユーザー名 > Settings から設定する。

- 設定はいずれも恒久設定となり、セッション切断後も保持される。



← 略語を自動的に含めて検索

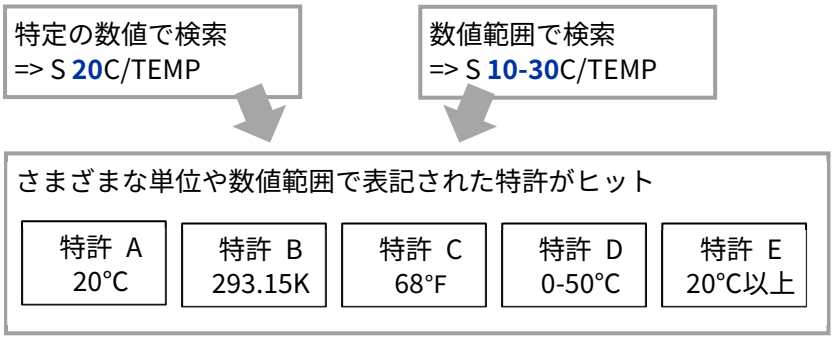
← 複数形を自動的に含めて検索

← 英米綴り違い等を自動的に含めて検索

テキスト中の数値検索

標題、抄録、クレームなどのテキスト中に含まれる数値を検索できる STN 独自の機能。

- 特定の数字で書かれた値だけではなく、数値範囲で書かれた値も検索できる。
- 単位の自動換算も行うため、検索に用いた単位と異なる単位で書かれた値もヒットする。
- 単位とリンクさせた検索が可能。
  - 例 1：特定の数値もしくは数値範囲で検索した場合



  - 例 2：=> S 60C/TEMP で検索した場合

    ヒットする記述
    … the glass transition temperature (Tg) of **50 degrees Celsius to 80 degrees Celsius**.
    The gelatin formation temperature is **135 degrees F**. thus …

    ヒットしない記述 ： 異なる物性値のデータ
    … it comprises the following steps: taking **50-60 kg** of methanol, …

対象ファイル

テキスト中の数値検索は下記のファイルで利用できる。タイプによって検索フィールド数や検索機能が異なる。

タイプ	物性の種類	特許全文ファイル	特許抄録ファイル	文献ファイル
A	33	-	-	2MOBILITY
B	55	-	-	1MOBILITY, AGRICOLA, COMPENDEX, FSTA, PQSciTech
C	59	AUPATFULL, CANPATFULL, CNFULL, DEFULL, EPFULL, FRFULL, GBFULL, INFULL, JPFULL, KRFULL, PCTFULL, RUFULL, TWFULL, USPAT2, USPATFULL	RDISCLOSURE, WPI	ANABSTR, CABA, CEABA, NTIS, RAPRA, TEMA

タイプ B 以降の主な特長

- アラビア数字だけでなくアルファベット表記 (one、two、three など) も検索できる。
- 単位がアルファベット表記でも検索できる。
  - 例 : meter per second、meter/second など
- 最小値や最大値のみで記載された数値範囲も検索できる。

検索方法

数値と数値検索フィールドを指定する。単位を省略すると、デフォルト単位で検索される。

```
=> S　数値　単位/数値検索フィールド
```

- 数値検索フィールドのコードに .EX と付けて検索すると、特定の数値，または最大値と最小値が特定された数値範囲に限定して検索できる。

```
=> S　数値　単位/数値検索フィールド.EX
```

/PHP フィールド

/PHP フィールドを使うと、数値を具体的に指定しなくても、目的の物性の数値データが記載されている文献をまとめて検索できる。

```
=> S　数値検索フィールド/PHP
```

入力例

=> S 60 C/TEMP ← 温度 60 ℃ の検索
=> S 50<=M ← 質量 50 kg 以上の検索
=> S 100-300/MFL ← 質量流量 100-300 kg/s の検索
=> S DOS/PHP ← 投与量の数値が記載されているものを検索

=> S (TG OR GLASS TRANSIT? TEMP?) (5A) 200C/TEMP ← ガラス転移温度が 200℃
=> S (TG OR GLASS TRANSIT? TEMP?) (5A) TEMP/PHP ← ガラス転移温度の温度の数値が記載されているもの

=> S LED/CLM (10A) 5000<=LUME ← クレーム中の照度が 5000 ルクス以上
=> S LED/CLM (10A) LUME/PHP ← クレーム中の照度についてルクスの数値が記載されているもの

数値検索フィールド一覧

検索フィールド	物性名	デフォルト単位	A	B	C
/AOS	物質量	mol	○	○	○
/BIR	ビットレート	bit/s (ﾀｲﾌﾟ A は bit)	○	○	○
/BIT	保存情報	bit		○	○
/CAP	静電容量	F		○	○
/CATA	触媒活性	kat			○
/CDN	電流密度	A/m**2		○	○
/CMOL	モル濃度	mol/L	○	○	○
/CON	コンダクダンス	S	○	○	○
/DB	デシベル	db		○	○
/DEG	角度	degree	○	○	○
/DEN	密度、質量濃度	kg/m**3	○	○	○
/DEQ	線量当量	Sv		○	○
/DOA	1 日当たりの投与量	mg/kg/day			○
/DOS	投与量	mg/kg		○	○
/DV	動的粘度	Pa*s	○	○	○
/ECH	電荷	C		○	○
/ECD	電荷密度	C/m**2		○	
/ECO	電気伝導率	S/m		○	○
/ELC	電流	A		○	○
/ELF	電場	V/m		○	○
/ENE	エネルギー	J	○	○	○
/ERE	電気抵抗率	ohm*m		○	○
/FOR	力	N	○	○	○
/FRE	周波数	Hz	○	○	○
/IU	国際単位	IU		○	○
/KV	動粘度	m**2/s	○	○	○
/LEN (ﾀｲﾌﾟ A は /SIZ)	長さ	m	○	○	○
/LUME	照度	lx	○	○	○
/LUMF	光束	lm	○	○	○
/LUMI	光度	cd	○	○	○
/M	質量	kg	○	○	○
/MCH	質量電荷比	m/z		○	○
/MFD (ﾀｲﾌﾟ A は /MFS)	磁束密度	T	○	○	○
/MFR (ﾀｲﾌﾟ A は /MFL)	質量流量	kg/s	○	○	○
/MFST	磁界強度	a/m			○
/MM (ﾀｲﾌﾟ A は /MW)	モル質量、分子量	g/mol	○	○	○
/MOLS	重量モル濃度	mol/kg		○	○
/MVR	メルトフローレート	g/10 min		○	○
/NUC	栄養素含量	g/100*kcal		○	
/PER	パーセント	%	○	○	○
/PERA	誘電率	F/m		○	
/PHV	水素イオン指数	ph	○	○	○
/POW	電力	W	○	○	○
/PPM	ppm	ppm			○

検索フィールド	物性名	デフォルト単位	A	B	C
/PRES	圧力	Pa	○	○	○
/RAD [1)]	放射能	Bq	○	○	○
/RES	電気抵抗	Ohm	○	○	○
/RI	屈折率	-			○
/RSP	回転速度	rpm		○	○
/SAR	面積	m**2	○	○	○
/SOL	溶解度	g/100g		○	○
/SSAM [2)]	比表面積	m**2/kg			○
/STSC	表面張力、ばね定数	J/m**2	○[3)]	○	○
/TCO	熱伝導率	W/m*K		○	○
/TEMP	温度	K	○	○	○
/TEX	テックス	g/km			○
/TIM	時間	s	○	○	○
/VEL	速度	m/s	○	○	○
/VELA	角速度	rad/s(ﾀｲﾌﾟ A は rpm)	○	○	○
/VLR	体積流量	m**3/s		○	○
/VOL	体積	m**3	○	○	○
/VOLT	電圧	V	○	○	○

1) USPATFULL、USPAT2 では /RADI
2) USPATFULL、USPAT2 では /SSA でも検索可能
3) タイプ A では表面張力 (/ST、デフォルト単位：J/m**2)、ばね定数 (/SCO、 デフォルト単位：N/m)

デフォルト単位の変更・許容誤差範囲の指定

SET UNIT でデフォルトの単位を変更できる。

- 入力例 ： 温度のデフォルト単位をケルビン（K）から摂氏 (°C) に変更する場合

```
=> FILE USPATFULL                    ← 数値検索ができるファイルに入る

=> S 20/TEMP
L1          444599 20 K /TEMP        ← デフォルト単位はケルビン (K)

=> SET UNIT TEMP=C                   ← SET UNIT でデフォルト単位を摂氏 (°C) に変更する
SET COMMAND COMPLETED

=> D UNIT                            ← 変更したデフォルト単位は、D UNIT で確認できる
TEMP                CURRENT:     C

=> S 20/TEMP
L2          785733 20 C /TEMP        ← デフォルト単位が摂氏 (°C) に変更された
```

* SET UNIT の設定は、数値検索可能なファイルすべてに影響する。

- 数値範囲を検索する際、＋－で誤差範囲を指定することができる。

```
=> S 50+-10 ST/KV
L3          8954 50+-10 ST/KV

=> S 50+-20% ST/KV
L4          8954 50+-20% ST/KV
```

特許全文ファイルのテキスト検索の注意点

- テキストの抽出
  - 一部の全文テキストは OCR (Optical Character Recognition) で作成されている。そのため、適切にテキストを抽出できない場合がある。
- テキスト中の数値検索
  - テキストをうまく認識できず、該当の物性値であっても、テキスト中の数値検索機能が使えない場合がある。
- 表中のテキストの抽出
  - ファイルにより、表中のテキストを検索できる場合とできない場合がある。
  - USPATFULL/USPAT2 ファイルは、表中のテキストの抽出が良好。

特許番号類の検索

特許番号類を用いた検索

- 特許番号、出願番号、優先権出願番号を、ISO 国名コードと一緒に入力する。

検索フィールド	内容	入力例
/PN	特許番号	=> S JP10182321/PN
/PNK	種別付き特許番号	=> S CN1305834C/PNK
/AP	出願番号	=> S JP1997-283443/AP
/PRN	優先権出願番号	=> S FR1996-12616/PRN

特許番号の形式

- 特許番号は STN の入力形式に従って入力する。国・特許種別、ファイルによって入力形式が異なるため、EXPAND で確認するとよい。

例	形式	入力例
西暦は含めない (連続番号を付与する国)	国名コード＋番号 (桁合わせなし)	=> S US4634683/PN
西暦を含める (毎年番号を付与しなおす国)	国名コード＋西暦 2 桁＋5 桁の番号 (桁合わせする)	=> S WO9115596/PN
	国名コード＋西暦 4 桁＋6 桁の番号 (桁合わせする)	=> S WO2000010370/PN
種別コードを後ろに付ける	国名コード＋番号 (桁合わせなし) ＋種別コード	=> S JP2500019B/PN

出願番号、優先権出願番号の形式

出願番号	形式	入力例
PCT 出願以外	国名コード＋西暦 4 桁＋ハイフン＋番号 (桁合わせなし)	=> S JP1985-186513/AP => S JP1985-186513/PRN
PCT 出願	WO＋西暦 4 桁＋ハイフン＋国名コード＋番号 (桁合わせなし)	=> S WO2001-JP4892/AP => S WO1997-US21463/PRN

オリジナル形式の特許番号類の検索

- USPATFULL/USPAT2/USPATOLD 以外の特許全文ファイルは、オリジナル形式（公報に記載されている番号形式）の特許番号類が収録されている。

- オリジナル形式の特許番号類はカスタム表示形式でのみ表示可能。

検索フィールド	内容	入力例	表示フィールド
/PNO	特許番号、オリジナル	=> S IN3451DEL2011/PNO	PNO
/APO	出願番号、オリジナル	=> S KR 1020220173109/APO	APO
/PRNO	優先権出願番号、オリジナル	=> S TW111130240 /PRNO	PRNO

種別付き特許番号

- 種別付き特許番号（/PNK）は特許番号と特許種別コードの両方を指定して検索したい場合に利用する。

  - 異なる種別で全く同じ特許番号が付与されている場合に、特許番号と種別を両方指定して検索することで、より的確に目的の回答を得ることができる。

    例） 中国の公開・登録特許（公開特許と、それとは異なる発明の登録特許に同じ特許番号が付与されていた年代がある）

```
=> FILE CNFULL

=> E CN1305835 A/PNK
E1            1      CN1305834 A/PNK
E2            1      CN1305834 C/PNK
E3            1 --> CN1305835 A/PNK
E4            1      CN1305835 C/PNK
E5            1      CN1305836 A/PNK
     :
```

/PNK で検索すると、公開（CNA）番号と登録（CNC）番号を区別できる

検索例：日本公開公報（特開 2023-9251）を検索する。（JPFULL ファイル）

```
=> FILE JPFULL            ← JPFULL ファイルに入る

=> E JP20239251/PN        ← EXPAND で入力形式を確認
E1          1     JP2023923Y/PN
E2          1     JP2023924Y/PN
E3          0 --> JP20239251/PN          ← 桁合わせが必要であることがわかる
E4          1     JP2023925Y/PN
E5          1     JP2023926Y/PN
   :

=> E JP2023009251/PN      ← 番号の前に 0 を足して桁合わせをする
E1          1     JP2023009249/PN
E2          1     JP2023009250/PN
E3          1 --> JP2023009251/PN
E4          1     JP2023009252/PN
E5          1     JP2023009253/PN
   :
=> S E3
L1          1 JP2023009251/PN

=> D

L1     ANSWER 1 OF 1 JPFULL COPYRIGHT 2024 LNBIS on STN.

AN     2022049400   JPFULL EDP 20230122  ED 20230122 UP 20240324 EDTX 20230122
       DED 20230119 DUPD 20240320 Full-text
TIEN   AMANTADINE COMPOSITIONS, PREPARATION THEREOF, AND METHODS OF USE
TIJA   アマンタジン組成物、その調製、および使用方法
IN     GREGORY T WENT;
       TIMOTHY J FULTZ;
       SANGITA GHOSH;
       NATALIE MCCLURE
PA     ADAMAS PHARMA LLC
PAS    ADAMAS PHARMA
PA.NO  517360697
AGN    100078282; 100113413; 100181674; 100181641; 230113332
LAF    Japanese
LA     Japanese
DT     Patent; (Fulltext)
PI     JP 2023009251          A     20230119
PIT    JPA PUBLISHED UNEXAMINED PATENT APPLICATION [FROM 19710716 ONWARDS] or
       PUBLISHED UNEXAMINED PATENT APPLICATION (BASED ON INTERNATIONAL
       APPLICATION) [FROM 19790726 ONWARDS]
AI     JP 2022-183927                 20221117
PRAI   JP 2020-511528                 20180823
       US 2017-62549921               20170824
       WO 2018-US47754                20180823
RLPI   WO 2019040748                  20190228
RLI    WO 2018-US47754                20180823   PCT Application
       JP 2020-511528                 20180823   Parent Application
IPCI   A61K0031-13 [I,A]; A61K0009-48 [I,A]; A61P0025-14 [I,A]; A61P0025-16
       [I,A]
CPC    A61K0009-5026; A61K0009-5015; A61K0009-5047; A61K0009-5078;
       A61K0009-0053; A61P0025-16; A61P0025-14; A61P0025-28; A61K0031-136;
         :
```

特許出願人の検索

- 特許出願人に関する検索フィールド

検索フィールド	内容	入力例
/PA	特許出願人	=> S TORAY/PA => S SUMITOMO 3M/PA
/PAS *1	特許出願人、標準形式	=> S SAMSUNG ELECTRONICS/PAS
/PAN *1	特許出願人、統制形式	=> S MICROSOFT/PAN
/PA.T *1	特許出願人、全データ	=> S FUJI FILM/PA.T
/USPA *2	特許出願人（会社）	=> S MITSUI CHEMICALS/USPA

*1 USPATFULL、USPAT2、USPATOLD では利用不可
*2 USPATFULL、USPAT2 のみで利用可

  - 上記の検索フィールドは、スペースを入力すると自動的に (S) 演算子となる。

- スーパー検索フィールド /PASS で出願人関連フィールドをまとめて検索できる。

  - /PASS はスペースを入力するとフレーズ検索になるため、演算子を入力して単語単位で検索するとよい。

最終権利者の検索

売却、合併、企業再編を経た後の特許の最終権利者の情報を検索できる。

- 最終権利者に関する検索フィールド

検索フィールド	内容	入力例
/UO	最終権利者	=> S SUMITOMO 3M/UO
/UOS	標準化した最終権利者	=> S SAMSUNG ELECTRONICS/UOS

  - /UO、/UOS は RUFULL、TWFULL、USPATOLD ファイルでは利用できない。(2025 年 7 月現在)

検索例 ： パナソニック社が特許出願人もしくは最終権利者である日本特許を検索する。
(JPFULL ファイル)

```
=> FILE JPFULL            ← JPFULL ファイルに入る

=> S PANASONIC/PASS       ← スーパー検索フィールド /PASS で出願人関連フィールドをまとめて
                            検索する
        145926 PANASONIC/PA
        145925 PANASONIC/PAS
        692697 PANASONIC/PA.T
        678234 PANASONIC/PAN
        759589 PANASONIC/UO
        759589 PANASONIC/UOS
L1      829148 PANASONIC/PASS
                 (PANASONIC/PA,PAS,PA.T,PAN,UO,UOS)

=> D 1 688

L1      ANSWER 1 OF 829148 JPFULL COPYRIGHT 2025 LNBIS on STN.

AN      2025001836   JPFULL EDP 20250414  ED 20250414 UP 20250414 EDTX 20250414
        DED 20250411 DUPD 20250411 Full-text
TIEN    Information acquisition method and information acquisition device
TIJA    情報取得方法及び情報取得装置
PA      Panasonic Intellectual Property Corporation of America;
PAS     PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA
PAN     PANASONIC
PA.NO   514136668
LAF     Japanese
LA      Japanese
DT      Patent; (Fulltext)
PI      JP 2025061988            A     20250411
          :

L1      ANSWER 688 OF 829148 JPFULL COPYRIGHT 2025 LNBIS on STN.

AN      2024019977   JPFULL EDP 20240826  ED 20240826 UP 20250330 EDTX 20240826
        DED 20240821 DUPD 20250326 Full-text
TIEN    AUTOMOBILE CAMERA ASSEMBLY
TIJA    自動車用カメラアセンブリ
IN      DANIEL ABAD GARCIA
PA      FICOSA ADAS SLU;
PAS     FICOSA ADAS SLU
PA.NO   516284976
UO      PANASONIC CORPORATION
UOS     Panasonic
LAF     Japanese
LA      Japanese
DT      Patent; (Fulltext)
PI      JP 2024112931            A     20240821
          :
```

FICOSA ADAS SLU 社が特許出願を行ったが、
現在はパナソニック社が権利を有している

特許分類の検索

CAS STNext では下記の特許分類を検索できる。

- 国際特許分類（IPC）　：　世界知的所有権機関作成の国際的に統一された特許分類
- 共通特許分類（CPC）　：　ヨーロッパ特許分類と米国特許分類を統合した分類
- FI、F ターム　：　日本特許庁独自の特許分類

特許分類の主な検索フィールド

検索フィールド	内容	入力例
/IPC	すべての国際特許分類（IPC）	=> S C07C/IPC => S C07C0015/IPC => S C07C0015-08/IPC
/CPC	共通特許分類	=> S C12N/CPC => S C12N0009/CPC => S C12N0009-0004/CPC
/FCL	FI	=> S G01N0024/FCL => S ZAA/FCL
/FTERM	F ターム	=> S 2E100/FTERM => S 4C077/AA05/FTERM

- オンラインシソーラスを利用できるファイルでは、階層構造を調べたり、関係コードを利用して下位の階層を含めた検索を行うことができる。
- 収録されている特許分類はファイルによって異なる。各ファイルの収録状況や、上記以外の検索フィールドについては、サマリーシートを参照。
https://www.cas.org/training/documentation/stn/database-summary-sheets

国際特許分類（IPC）

IPC は特許文献の技術内容による分類であり、国際的に統一されている。
下記のように階層構造を形成している。

```
セクション・・・・・・・・・・・・・・繊維；紙
 クラス・・・・・・・・・・・・・・・・製紙；セルロースの製造
  サブクラス・・・・・・・・・・・・・・セルロース含有材料から非セルロース物質を除去することによる
                                        セルロースの製造；パルプ化薬液の再生；そのための装置
   メイングループ・・・・・・・・・・セルロースパルプの後処理
    サブグループ・・・・・・・・・・・漂白
D２１Ｃ９／１０
```

- /IPC フィールドで、すべての版の IPC を網羅的に検索できる。

- 下記のように STN 形式に直して入力する。

D２１Ｃ０００９-１０

メイングループの先頭に 0（ゼロ）を挿入して 4 桁とする

メイングループとサブグループとの間はハイフン (-) を入力する

- 入力例

=> S D21!/IPC	(クラスまで指定)	← D21 の下位も含めて検索
=> S D21C/IPC	(サブクラスまで指定)	← D21C の下位も含めて検索
=> S D21C0009/IPC	(メイングループまで指定)	← D21C9 の下位も含めて検索
=> S D21C0009-1?/IPC	(サブグループまで指定)	← D21C9 のうち 1 で始まるサブグループをすべて検索
=> S D21C0009-10+NT/IPC		← D21C9/10 の下位も含めて検索

- 範囲指定検索

  - サブグループ間の範囲指定検索は、コードの間にハイフン (-) を入力する。

    => S C08G0018-00-C08G0018-87/IPC ← 範囲指定検索はサブグループまで入力

- SET ICFORMAT

  - IPC を IPC 8 形式 （メイングループ 4 桁） で表示･抽出する際は下記の設定を行う。

    => SET ICFORMAT ON ← IPC 8 形式で表示・抽出
    => SET ICFORMAT ON PERM ← 恒久設定
    => SET ICFORMAT OFF ← 設定解除（デフォルト）

- 検索のポイント

  - 網羅的に検索する場合は IPC 8 とともに、キーワードや過去の IPC なども含めて検索する。
  - 特許発行数の少ない国では、サブクラスまでしか付与していない場合がある。
    そのような特許も含めて検索する場合は、サブクラスまで指定して検索する。

共通特許分類（CPC）

CPC は、ヨーロッパ特許分類と米国特許分類を統合した分類であり、ECLA の体系をベースにしている。

- /CPC フィールドで、発行時および現行の分類を両方検索できる。
- 入力形式（STN 形式）
  - 国際特許分類の入力形式と同様に入力する。
- 入力例

=> S A61!/CPC	(クラスまで指定)	← A61 の下位も含めて検索
=> S A61K/CPC	(サブクラスまで指定)	← A61K の下位も含めて検索
=> S A61K0009/CPC	(メイングループまで指定)	← A61K9 の下位も含めて検索
=> S A61K0009-7038/CPC	(サブグループまで指定)	← A61K9/7038 のみを検索
=> S A61K0009-7038+NT/CPC		← A61K9/7038 の下位を含めて検索

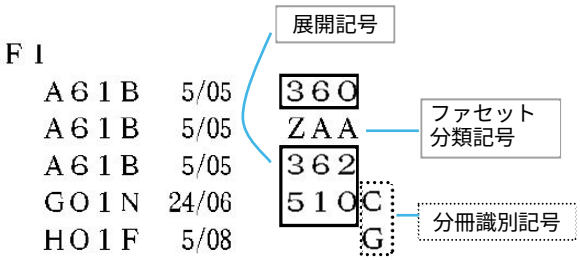
- 範囲指定検索
  - サブグループ間の範囲指定検索は、コードの間にハイフン（-）を入力する。

    => S A61K0009-7038-A61K0009-7076/CPC ← 範囲指定検索はサブグループまで入力

日本の特許分類 FI

FI は IPC を細分化した日本特許庁独自の特許分類である。

- /FCL フィールドで検索する。
  現行の分類を検索できる。
- 特許全文ファイルでは JPFULL ファイルで
  利用できる。



- 入力例

=> S G01?/FCL	← クラスまで指定して検索（下位を含む）
=> S G01N/FCL	← サブクラスまで指定して検索（下位を含む）
=> S G01N0024/FCL	← メイングループまで指定して検索（下位を含む）
=> S G01N0024-06/FCL	← サブグループまで指定して検索 (展開記号・分冊識別記号が付与された FI を含む)
=> S G01N0024-06 510 ?/FCL	← 展開記号まで指定して検索 (分冊識別記号が付与された FI を含む)
=> S G01N0024-06 510 C/FCL	← 分冊識別記号を指定して検索
=> S H01F0005-08 G/FCL	← 分冊識別番号のみ付与された FI を検索
=> S ZAA/FCL	← ファセット分類記号を検索

- FI (相補情報) を検索する場合のみ、- (ハイフン) を ： (コロン) にする。

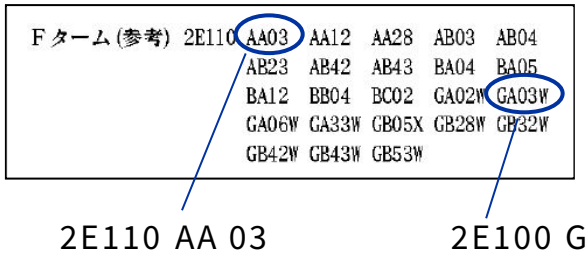
  => S A01N0043:54 D/FCL

- 範囲指定検索は不可。

日本の特許分類 F ターム

F タームは、技術的特徴に基づく観点によって分類した、日本特許庁独自の特許分類である。
テーマコードと観点・数字・付加コードから構成されている。

- /FTERM フィールドで検索する。
  現行の分類を検索できる。



2E110 AA 03　　2E100 GA 03 .W

テーマコード 観点 数字　　テーマコード 観点 数字 付加コード

- 特許全文ファイルでは JPFULL ファイルで利用できる。ただしシソーラスは収録されていない。

- 入力形式 (STN 形式)

  - テーマコードと観点の間は / (スラッシュ) を入力する。

- 入力例

=> S 2E110/FTERM	(テーマコードまで指定)	← 2E110 の下位も含めて検索
=> S 2E110/GA02/FTERM	(観点・数字まで指定)	← 2E110 GA 02 を検索 (付加コードが付与された分類も含む)*1
=> S 2E110/GA03.W/FTERM	(付加コードまで指定)	← JPFULL ファイルでは付加コードの 前にピリオドを入力する*2

*1 F タームのシソーラスが搭載されている CAplus/CA、WPI ファイルでは下位を含めての検索が可能 (S 2E110/GA02+NT/FTERM)
*2 CAplus/CA ファイルでは付加コードの前にピリオドは不要 (=>S 2E110/GA03W/FTERM)

- 範囲指定検索は不可。

検索例 ： 材料として多結晶ダイヤモンドが用いられている人工関節に関する特許について、キーワードおよび IPC、CPC を用いて調査する。(PCTFULL ファイル)

```
=> FILE PCTFULL          ← PCTFULL ファイルに入る

=> E A61F0002-30/IPC     ← 人工関節に関する IPC の定義をシソーラスで確認

E#   FREQUENCY    AT     TERM
--   ---------    --     ----
E1         236     2     A61F0002-26/IPC
E2        3056     2     A61F0002-28/IPC
E3        5055     8 --> A61F0002-30/IPC
E4           1           A61F0002-304/IPC
E5         737     4     A61F0002-32/IPC
  :

=> E E3+ALL

E1           0   BT6   A/IPC
                       HUMAN NECESSITIES
    :
E7        3672   BT1   A61F0002-02/IPC            ← 上位語
                       . Prostheses implantable into the body
                       ADVANCED
                       VALID FROM 19850101 TO PRESENT   (  IPC EDITION: 4-8  )
E8        5055   -->   A61F0002-30/IPC
                       . . Joints
                       ADVANCED
                       VALID FROM 19850101 TO PRESENT   (  IPC EDITION: 4-8  )
E9         737   NT1   A61F0002-32/IPC            ← 下位語
                       . . . for the hip
                       ADVANCED
                       VALID FROM 19850101 TO PRESENT   (  IPC EDITION: 4-8  )
   :
E16       3412   NT1   A61F0002-46/IPC
                       . . . Special tools for implanting artificial joints
                       (surgical instruments A61B0017-00)
                       ADVANCED
                       VALID FROM 19850101 TO PRESENT   (  IPC EDITION: 4-8  )
********** END **********


=> S A61F0002-30+NT/IPC,CPC              ← 下位語も含めて検索する
L1       13514 A61F0002-30+NT/IPC,CPC

=> S (ARTIFICIAL OR PROSTHE?)(5A)(JOINT OR ARTICULA?)      ← キーワードを検索する
L2       12976 (ARTIFICIAL OR PROSTHE?)(5A)(JOINT OR ARTICULA?)

=> S L1 OR L2
L3       21955 L1 OR L2

=> S L3 AND (POLYCRYSTAL? (1W) DIAMOND)   ← 多結晶ダイヤモンドで限定する
L4          60 L3 AND (POLYCRYSTAL? (1W) DIAMOND)
```

```
=> D TI KWIC 1-10          ← KWIC 表示形式で表示する

L4      ANSWER 1 OF 60 PCTFULL COPYRIGHT 2024 LNBIS on STN.
TIEN    DIAMOND SURFACE BEARINGS FOR SLIDING ENGAGEMENT WITH METAL SURFACES
TIFR    PALIERS DE SURFACE EN DIAMANT POUR UNE MISE EN PRISE COULISSANTE AVEC
        DES SURFACES METALLIQUES
  :

L4      ANSWER 9 OF 60 PCTFULL COPYRIGHT 2024 LNBIS on STN.
TIEN    POLYCRYSTALLINE DIAMOND COMPACTS, AND RELATED METHODS AND APPLICATIONS
TIFR    PASTILLES EN DIAMANT POLYCRISTALLIN, PROCEDES ET APPLICATIONS ASSOCIES

ABEN
        Original
        Embodiments relate to polycrystalline diamond compacts ("PDCs")
        including a polycrystalline diamond ("PCD") table in which a
        metal-solvent catalyst is alloyed with at least one alloying element to
        improve thermal stability and/or.  .  .
  :
DETDEN.  .  .
        utilized in applications other than cutting technology. For example, the
        disclosed PDC embodiments may be used in wire dies, bearings,
        artificial joints, inserts, cutting elements, and heat sinks. Thus,
        any of the PDCs disclosed herein may be employed in an article of.  .  .
TIEN    POLYCRYSTALLINE DIAMOND COMPACTS, AND RELATED METHODS AND APPLICATIONS
TIFR    PASTILLES EN DIAMANT POLYCRISTALLIN, PROCEDES ET APPLICATIONS ASSOCIES
     :

=> D 9                     ← デフォルトの表示形式（STD.M）で表示する

L4      ANSWER 9 OF 60 PCTFULL COPYRIGHT 2024 LNBIS on STN.

AN      2016161304   PCTFULL EDP 20161010  ED 20161010 UP 20231204 EDTX 20161010
        UPTX 20210327
        DED 20161006 DUPD 20230328 Full-text
TIEN    POLYCRYSTALLINE DIAMOND COMPACTS, AND RELATED METHODS AND APPLICATIONS
TIFR    PASTILLES EN DIAMANT POLYCRISTALLIN, PROCEDES ET APPLICATIONS ASSOCIES
IN      BERTAGNOLLI, Kenneth E., 11762 Whatta View Place, Riverton, Utah 84065,
  :
PA      US SYNTHETIC CORPORATION, 1260 South 1600 West, Orem, Utah 84058,
        84058, US, [NAT: US, RES: US], for all designated states
PAS     US SYNTHETIC
AG      SIMON, Marcus S. et al., Kearns Building, 136 South Main Street, Suite
        1000, Salt Lake City, Utah 84101-1685, US
LAF     English
LA      English
DT      Patent; (Fulltext)
PI      WO 2016161304            A1     20161006
DS      W:             AE AG AL AM AO AT AU AZ BA BB BG BH BN BR BW BY BZ CA CH
  :
PIT     WOA1 INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH INTERNATIONAL SEARCH
        REPORT
AI      WO 2016-US25586                20160401
PRAI    US 2015-14677875               20150402
IPCI    E21B0010-42 [I,A]; B22F0003-15 [I,A]; E21B0010-54 [I,A]
CPC     C22C0029-08; B22F0007-064; B22F2003-244; C22C0029-067; E21B0010-5735;
        B22F0003-14; B22F2007-066
```

参考 ： Interactive Claims Viewer

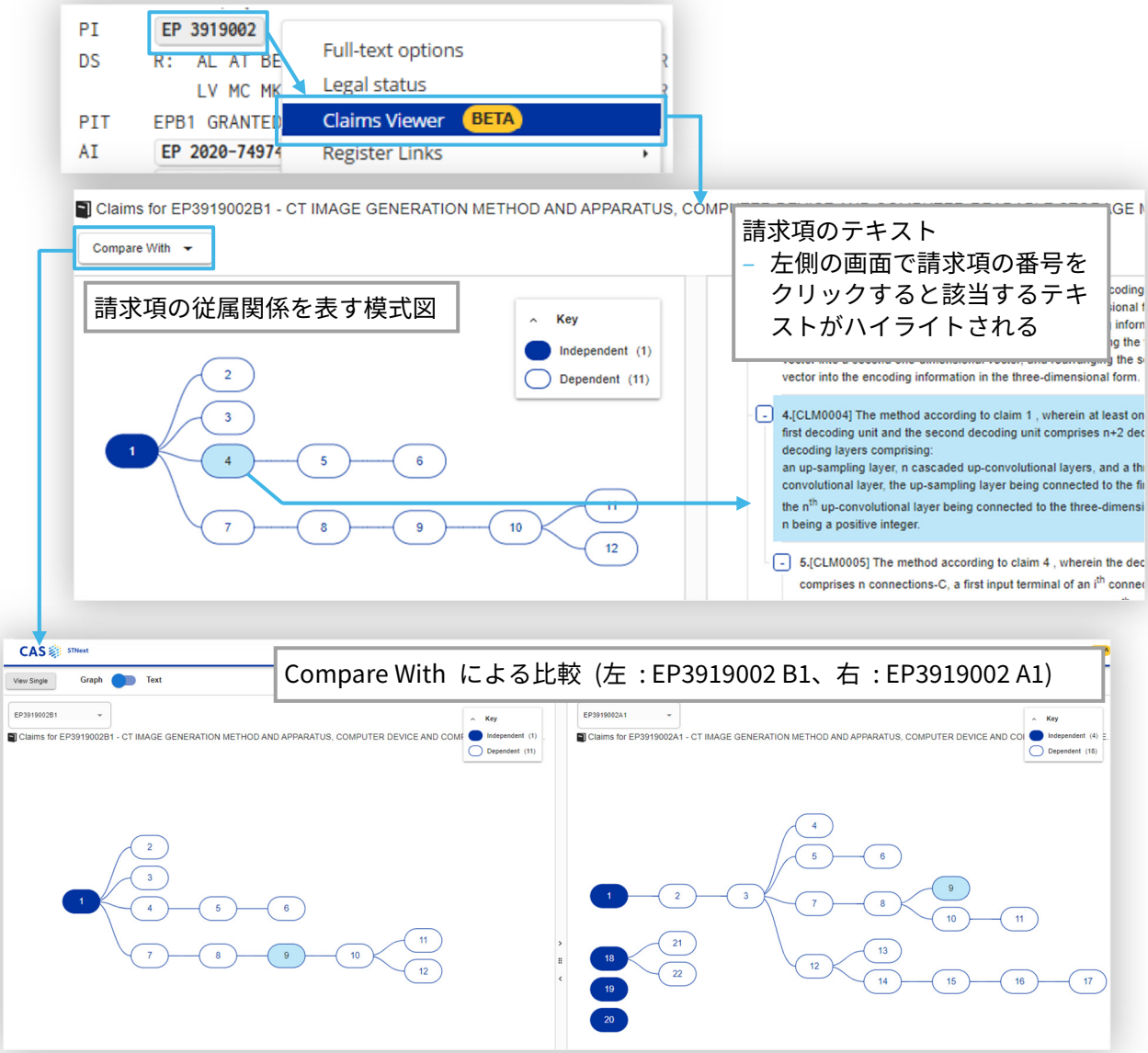
特許請求項をツリー形式で表示する Interactive Claims Viewer は、請求項の従属関係を容易に確認することができる機能である。

- 2024 年 12 月現在、EPFULL、JPFULL、 PCTFULL ファイルで利用可能で、今後、他の全文ファイルにも搭載される予定。

利用方法

書誌情報中の特許番号をクリックし、表示されるメニューから Claims Viewer リンクをクリックすると Interactive Claims Viewer が別タブで開く。

- Interactive Claims Viewer の左側の画面では請求項の従属関係の模式図がツリー形式で表示され、右側の画面では請求項のテキストが表示される。
  - Compare With ボタンで同一出願の各公報の請求項を比較することができる。

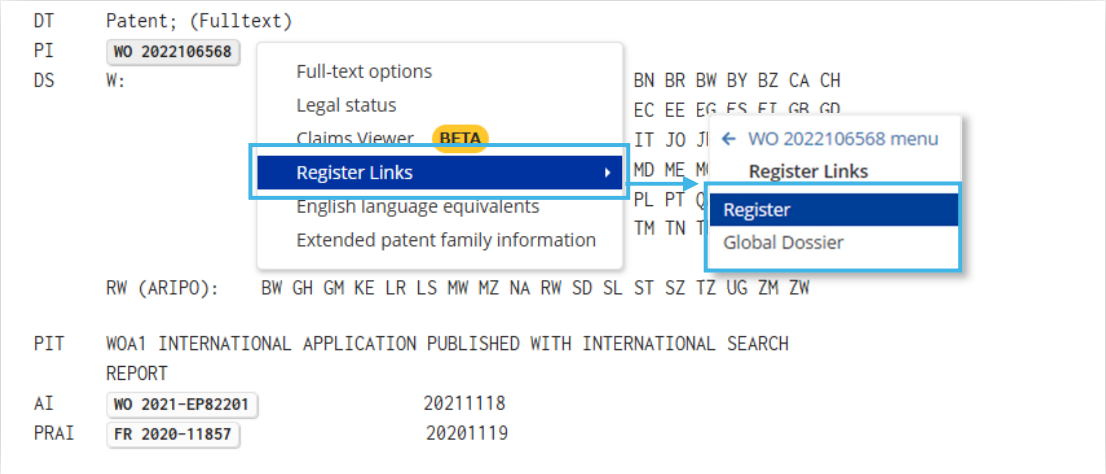


参考 ：Register リンク

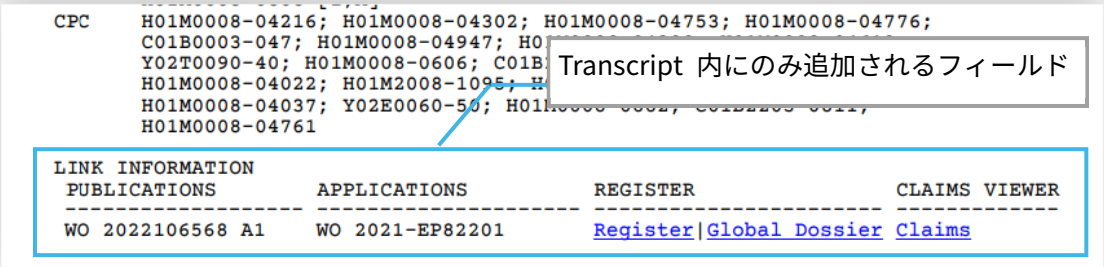
Register リンクは、各国特許庁や関連サイトにすぐにアクセスできるリンクである。

- 特許番号と出願番号の両方を同時に表示すると、特許番号または出願番号のプルダウンメニューから Register リンクを利用できるようになる。
  - 特許発行機関によって表示されるリンクが異なる。

リンクの種類	リンク先
Register	各国特許庁へのリンク (直接公報にリンクするかは特許発行機関による)
Global Dossier	EPO の Global Dossier へのリンク。CN, JP, KR, US, WO が対象
Federated Register	EPO の Federated Register へのリンク。EP が対象



- Settings の Include Link Information Table を ON にすると、ダウンロードした Transcript やレポートに Register リンクを含めることができる。



JAICI について

一般社団法人化学情報協会 (JAICI) は、化学技術情報の流通を図るため 1971 年に設立されました。米国 CAS をはじめ世界各国の情報機関などと協力関係を築き、日本の研究者をサポートする情報センターとして、大学・企業などの情報取得・分析から研究・開発までを支援しています。

CAS STNext に関するお問い合わせ先
https://www.jaici.or.jp/inquiry/

About CAS

CAS connects the world's scientific knowledge to accelerate breakthroughs that improve lives. We empower global innovators to efficiently navigate today's complex data landscape and make confident decisions in each phase of the innovation journey. As a specialist in scientific knowledge management, our team builds the largest authoritative collection of human-curated scientific data in the world and provides essential information solutions, services, and expertise. Scientists, patent professionals, and business leaders across industries rely on CAS to help them uncover opportunities, mitigate risks, and unlock shared knowledge so they can get from inspiration to innovation faster. CAS is a division of the American Chemical Society. Connect with us at **cas.org**

© 2024 American Chemical Society. All rights reserved.